

	Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 2: Nízký tlak vzduchu	ČSN EN 60749-2  35 8799
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

idt IEC 60749-2:2002

Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -  
Part 2: Low air pressure

Dispositifs à semiconducteurs - Méthodes d'essais mécaniques et climatiques -  
Partie 2: Basse pression atmosphérique

Halbleiterbauelemente - Mechanische und klimatische Prüfverfahren -  
Teil 2: Niedriger Luftdruck

## Oznámení o schválení

Evropská norma EN 60749-2:2002 Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 2: Nízký tlak vzduchu, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 60749-2:2002, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 60749-2 bez jakýchkoli modifikací. Evropská norma EN 60749-2:2002 má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení informací, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

## Endorsement notice

The European Standard EN 60749-2:2002 Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 2: Low air pressure which is the complete and unchanged adoption of the IEC 60749-2:2002, was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 60749-2 without any modification. The European Standard EN 60749-2:2002 has the status of a Czech Standard.

Both European and original International Standards are available at the Czech Standards Institute, Department of Information, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

## Anotace obsahu

Tato část normy IEC 60749 popisuje zkoušení nízkého tlaku vzduchu na polovodičových součástkách. Zkouška je určena především ke stanovení způsobilosti částí a materiálů součástek vyhnout se poruchám průrazem napětí, způsobeným snížením dielektrické pevnosti vzduchu a jiných dielektrických materiálů při snížených tlacích. Tato zkouška je vhodná pouze pro součástky u nichž pracovní napětí přesahuje 1 000 V.

Tato zkouška je vhodná pro všechny polovodičové součástky, za předpokladu, že jejich pouzdra patří

mezi typy s dutinou. Zkouška je určena pouze pro součástky používané pro vojenské a kosmické účely.

Obecně je tato zkouška nízkým tlakem vzduchu v souladu s IEC 60068-2-13, ale vzhledem ke specifickým požadavkům polovodičů, platí články této normy. Přijímaná norma se skládá ze tří stran anglického textu normy evropské a 11 stran anglicko-francouzského textu mezinárodní normy IEC.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje článek 3, kapitoly 3, ČSN IEC 749 (35 8799) z prosince 1997.

© Český normalizační institut,

2003

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

**66854**

---

**-- Vynechaný text --**